

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 3 月 27 日 (27.03.2003)

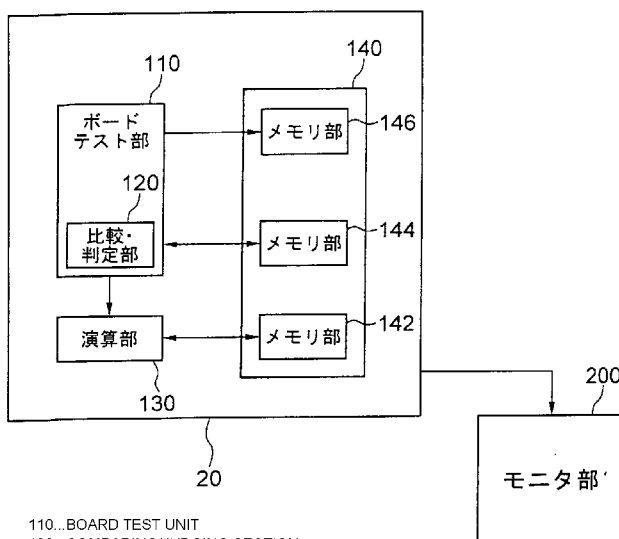
PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/025612 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01R 35/00, 31/28 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 久野 公夫
(21) 国際出願番号: PCT/JP02/09513 (KUNO, Kimio) [JP/JP]; 〒179-0071 東京都練馬区旭
町一丁目 3 2 番 1 号 株式会社アドバンテスト内
Tokyo (JP).
(22) 国際出願日: 2002 年 9 月 17 日 (17.09.2002)
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒
100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 富
士ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): CN, DE, KR, SG, US.
(30) 優先権データ: 添付公開書類:
特願2001-279356 2001 年 9 月 14 日 (14.09.2001) JP — 国際調査報告書
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会
社アドバンテスト (ADVANTEST CORPORATION)
[JP/JP]; 〒179-0071 東京都練馬区旭町一丁目 3 2 番
1 号 Tokyo (JP).
2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ELECTRIC COMPONENT TEST SYSTEM AND ELECTRIC COMPONENT TEST METHOD

(54) 発明の名称: 電気部品テストシステムおよび電気部品テスト方法



110...BOARD TEST UNIT
120...COMPARING/JUDGING SECTION
130...CALCULATING UNIT
146...MEMORY UNIT
144...MEMORY UNIT
142...MEMORY UNIT
200...MONITOR UNIT

(57) Abstract: An electric component test system comprising a test unit (10) for testing an electric component for each condition identifier so added as to identify each of test conditions different from one another, a memory unit (142) for previously storing prediction causes that are the causes of defects of an electric component determined by prediction and are related at least to the condition identifiers, a memory unit (144) for storing at least a defect-associated identifier which is the condition identifier of when the electric component is judged to be defective, out of the condition identifiers, and a calculating unit (130) for calculating parameters concerning defect-associated identifiers for each prediction cause when there are a plurality of defect-associated identifiers.

[続葉有]



(57) 要約:

本発明による電気部品テストシステムは、互いに異なる複数のテスト条件のそれぞれを識別することができるように付された条件識別子ごとに電気部品の良否をテストするテスト部 1 0 と、電気部品のうち予測して得た不良の原因である予測原因を少なくとも条件識別子のそれぞれに関連付けて予め格納しているメモリ部 1 4 2 と、条件識別子のうち、電気部品が不良と判断されたときの条件識別子である不良関連識別子を少なくとも格納するメモリ部 1 4 4 と、不良関連識別子が複数ある場合に、複数の不良関連識別子に関するパラメータを予測原因ごとに算出する演算部 1 3 0 とを備える。